

Annuncio di Seminario
Nell'ambito del corso "Affidabilità di Componenti e Sistemi VLSI"
giovedì 21 gennaio ore 14:30 sala riunioni R3

Introduzione alle architetture dei sistemi safety critical

Relatore: Dott. Davide D'Orazio
NEAT S.r.l.

I sistemi safety critical sono in grado di gestire funzioni sempre più complesse e diventano sempre più importanti nella vita di tutti i giorni.

Trasporti (auto, treni, aerei), apparecchi medicali, Impianti industriali, centrali nucleari sono solo alcuni esempi di settori in cui un malfunzionamento di un sistema può avere conseguenze catastrofiche.

Le architetture di questi sistemi hanno caratteristiche comuni e prevedono normalmente più unità di elaborazione che cooperano per realizzare la funzione di sicurezza. Ciascuna unità di elaborazione, e quindi i suoi sottosistemi HW ed il suo SW, deve rispettare una serie di vincoli e adottare una serie di tecniche standardizzate per garantire l'adeguato livello di integrità della sicurezza del sistema (SIL).

Per l'HW riveste grande importanza l'indipendenza e l'efficacia di rivelazione dei guasti, per il SW invece l'accento viene posto sul processo di sviluppo e sulla qualità: requisiti, progettazione, implementazione e test.

In questo Talk vengono presentati questi concetti e fatta un'introduzione alle architetture e alle tecniche, sia relative al HW che al SW, adottate su sistemi reali.

Note sul relatore

Il Dott. Davide D'Orazio è il direttore tecnico di NEAT supervisiona tutta l'attività produttiva con particolare attenzione all'attività di Ricerca e Sviluppo. Neat S.r.l. è specializzata nella progettazione di soluzioni HW e SW per applicazioni mission e safetycritical in ambito avionico/aerospazio, ferrotramviario, militare e industriale.

Esperto di progettazione di software di sistemi, di problematiche riguardanti la sicurezza, di sistemi operativi e di protocolli di comunicazione. E' responsabile dello sviluppo di tutti i progetti che vengono svolti da NEAT.

Contatto: Marco Ottavi (ottavi@ing.uniroma2.it)